# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-232216

(43)Date of publication of application: 22.08.2000

(51)Int.Cl.

H01L 27/146

HO4N 5/335

(21)Application number : 11-373998

(71)Applicant: EASTMAN KODAK CO

(22)Date of filing:

28.12.1999

(72)Inventor: GUIDASH ROBERT M

(30)Priority

Priority number: 98 224615

Priority date: 31.12.1998

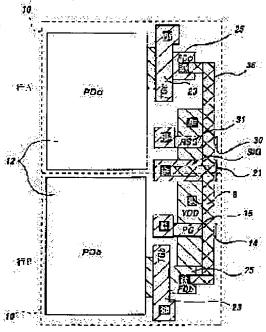
Priority country: US

# (54) ACTIVE PIXEL SENSOR HAVING FLOATING DIFFUSION PROVIDED WITH WIRING AND COMMON AMPLIFIER

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high filling rate of a photodiode active pixel architecture capable of executing a correlation double sampling.

SOLUTION: An image sensor having a plurality of pixels 10 arranged on continuous rows and columns consists of a semiconductor substrate having the plurality of the pixels 10 formed on the rows and columns. At least, the two pixels 10 are spacially separated from each other and the pixels 10 respectively have a voltage—charge conversion region electrically connected with a source of a single reset transistor 14. The pixels 10 holding the transistor 14 in common also holds an electrical selective function in common with an amplifier. In a preferable execution mode, the adjacent pixels are considered, but it in not needed that the pixels are immediately adjacent to each other.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.12.2006

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-232216 (P2000-232216A)

(43)公開日 平成12年8月22日(2000.8,22)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

H01L 27/146 H 0 4 N 5/335

H01L 27/14

H 0 4 N 5/335

# 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平11-373998

(22)出願日

平成11年12月28日(1999.12.28)

(31)優先権主張番号 224615

(32)優先日

平成10年12月31日(1998.12.31)

(33)優先権主張国

米国 (US)

(71)出顧人 590000846

イーストマン コダック カンパニー アメリカ合衆国, ニューヨーク14650, ロ チェスター, ステイト ストリート343

(72)発明者 ロパート エム ガイダッシュ

アメリカ合衆国, ニューヨーク 14618. ロチェスター、アントラーズ・ドライヴ

460

(74)代理人 100070150

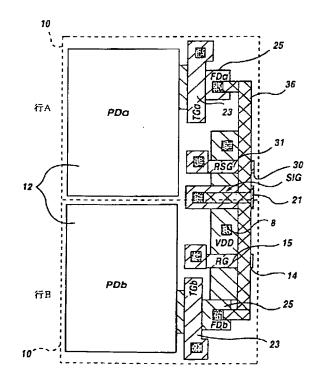
弁理士 伊東 忠彦 (外1名)

# (54) 【発明の名称】 配線されたフローティングディフュージョンと共通増幅器のあるアクティブピクセルセンサ

## (57)【要約】

【課題】 本発明は、相関二重サンプリングを実行でき る高充填比のフォトダイオードアクティブピクセルアー キテクチャを提供する。

【解決手段】 一連の行及び列に配された複数のピクセ ルを有する画像センサは、行及び列で形成された複数の ピクセルを有する半導体基板から成る。少なくとも2つ のピクセルの夫々は相互に空間的に分離され、単一のリ セットトランジスターのソースに電気的に接続された電 圧- 電荷変換領域を有する。リセットトランジスターを 共有するピクセルは、増幅器と選択電気的機能をも共有 する。好ましい実施態様は隣接ピクセルを考慮するが、 すぐ隣である必要はない



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一連の行及び列に配置された複数のピク セルを有する画像センサであって、

第一の導電性タイプの半導体材料と、

電荷- 電圧変換領域が相互に空間的に分離するように、 各ピクセルが作動的に光検出器に結合した電荷- 電圧変 換領域を有し、基板内に形成された少なくとも2つの隣 接ピクセルと、

電荷- 電圧変換領域間に形成された電気的接続とからな る画像センサ。

【請求項2】 ピクセルに対して動作する単一のリセッ トトランジスターを更に有する請求項1記載の画像セン サ。

【請求項3】 一連の行及び列に配置された複数のピク セルを有する画像センサであって、

第一の導電性タイプの半導体材料と、

電荷- 電圧変換領域が相互に空間的に分離するように、 各ピクセルが作動的に光検出器に結合した電荷- 電圧変 換領域を有し、基板内に形成された少なくとも2つの隣 接ピクセルからなる所定のサブセットのピクセルと、 電荷- 電圧変換領域間に形成された電気的接続とからな る画像センサ。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は固体フォトセンサ と、各ピクセルと関連したアクティブ回路素子を有する アクティブピクセルセンサ(APS)と呼ばれるイメー ジャとの分野に関し、より詳細には、光検出器から分離 された電荷- 電圧変換領域のあるピクセルの4つのトラ ンジスターピクセルと、相関二重サンプリング(correl ated doublesampling、CDS)とを利用する固体イメ ージャに関する。

## [0002]

【従来の技術】APSは固体イメージャであり、各ピク セルは光感知手段と、リセット手段と、電荷- 電圧変換 手段と、行選択手段と、さらに全て又は部分的に増幅器 とを具備する固体ピクセル素子を通常含む。ピクセル内 に集められた光電荷は、エリック フォサム(Eric Foss um) による1993年7月のSPIEの1900-08-8194-1133 巻で の「アクティブピクセルセンサ: CCDは恐竜か? (Ac 40 tive Pixel Sensors: Are CCD's Dinosaurs?) 」での先 行技術文献で説明されているようなピクセル内で、対応 する電圧若しくは電流に変換される。APSデバイスは イメージャの各ライン又は行が選択され、イ フォサム (E. Fossum) による1993年7月のSPIEの1900-08-8194-1 133 巻での「アクティブピクセルセンサ: CCDは恐竜 か? (Active Pixel Sensors: Are CCD's Dinosaurs?) 」や、R. H. Nixon, S. E. Kemeny、C. O. Staller と E. R. FossumによるSPIEのプロシーディング2415巻の 「オンチップタイミングと、コントロールと信号チェー 50

ン電子工学とを有する128×128CMOSフォトダ イオードタイプアクティブマトリックスセンサ (128x12 8 CMOS Photodiode-type Active Pixel Sensor with On -chip Timing, Controland Signal Chain Electronics) 」、1995年の論文34での「電荷結合素子と固体光学 センサV (Charge-Coupled Devices and Solid-State 0 ptical Sensors V) 」で説明された列選択信号を利用し て読出されるように作動した。アクティブピクセルセン サ内での行及び列の選択は、メモリ装置でのワード及び ビットの選択に類似する。ここで、全体の行の選択はワ ードを選択することに類似しており、アクティブピクセ ルセンサの一つの列からの読出しは、そのワード内で単 一のビットラインを選択又はイネーブリングすることに 類似する。従来の先行技術でのアクティブピクセルセン サ装置では、4つのトランジスター設計を利用するアー キテクチャを示しており、全ての4つのトランジスター は夫々及びいずかのピクセル内に含まれている。4つの トランジスターは、通常、トランスファー、行選択、リ セット及びソースフォロワ増幅器トランジスターであ る。このアーキテクチャは容易にCDSを実行し、低読 20 出しノイズが得られる能力を有するAPSが得られる利 点があり、上記4Tピクセルは低い充填比(fill facto r)である。充填比は光センサに当てるピクセル面積の割 合である。上記4つのトランジスターと関連するコンタ クト領域と信号バスは各ピクセルに配置され、コンタク ト領域は所望の重なりとさまざまな層の空間により、通 常大きなピクセル面積を使うので、ピクセルの充填比は 光検出器に利用される大きな面積のため減少する。上記 部品の夫々の適当なタイミング信号への接続は、ピクセ ルの全体の行を横行する金属バスにより行われる。上記 金属バスは光学的に不透明であり、光検出器の領域をさ えぎり、ピクセルピッチに適合する。更に、このことは ピクセルの充填比を減少させる。充填比を減少させるこ とは、センサの感度及び飽和信号を低下させる。上記の ことはセンサの写真スピードやダイナミックレンジ、さ らに高画質を得るために重要である性能測定に悪影響を

【0003】米国特許出願番号第08/808、444 号及び第08/911、235号において、Guidash は、フローティングディフュージョン、行選択トランジ スター、リセットトランジスター及び隣接行のピクセル 間のソースフォロワ入力トランジスターを共有すること により、先行技術での4つのトランジスターピクセルの 機能性を維持するピクセルアーキテクチャを開示してい る。上記アーキテクチャでは、単一のフローティングデ ィフュージョン領域は、2又は4つの隣接ピクセル間で 共有される。上記アーキテクチャは高い充填比を提供す るが、物理的に大きなフローティングディフュージョン 領域を生じさせる。このことは、電荷- 電圧変換ノード の全静電容量の大部分であるフローティングディフュー

ジョンの電圧に依存する接合静電容量により、一層非線 形な電荷- 電圧変換が生じる。更に、各ピクセル内の光 検出器の同じ配置を維持しようとすると、フローティン グディフュージョンとリセットトランジスターの非効率 なレイアウトが招来する。非線形電荷- 電圧変換は可変 なカラーバランスのアーティファクトをもたらす。各ピ クセル内の光検出器の同じでない配置により、別のアー ティファクトが生じる。上記アーティファクトの双方と も画質に悪影響をもたらす。

【0004】典型的な先行技術でのフォトダイオードA PSピクセルを図1に示す。図1に示すピクセルは、フ ォトダイオード (PD)、トランスファートランジスタ ー (TG)、フローティングディフュージョン (F D)、リセットゲート(RG)のあるリセットトランジ スターと、行選択ゲート(RSG)のある行選択トラン ジスターと、ソースフォロワ入力信号トランジスター (SIG)とからなる先行技術での4つのトランジスタ ーピクセルである。上記先行技術でのピクセルの充填比 は通常25%以下である。

【0005】Guidash により提案された別のピクセルア 20 ーキテクチャを、図2及び図3に示す。図2では、2つ の行隣接ピクセル、ピクセルA及びピクセルBは、分離 フォトダイオードとトランスファーゲート、PDa、P Db、TGa、TGbを夫々有するが、他の全ての構成 部品、FD、RG、RSG及びSIGを共有する。図3 では、1及び2は行を、a及びbは列を夫々表わし、4 つの行及び列隣接ピクセル、ピクセルla、2a、1b 及び2bは分離PD'sとTG's、PD1a、PD2 a、PD1b、PD2b、TG1a、TG2a及びTG 2 bを有するが、他の全ての構成部品FD、RG、RS G及びSIGを共有する。この場合、行ごとに2つのト ランスファーゲートバスがあり、隣接列からの信号電荷 の混合を防止している。上記アーキテクチャは、図1に 示す先行技術でのピクセルよりは実質的に高い充填比 を、つまり小さなピクセルを提供するが、前述したよう に、数多の欠点がある。図2に示す2つの隣接ピクセル 又は図3に示す4つの隣接ピクセルのいずれかにより共 有される単一のフローティングディフュージョン領域を 有することにより、図1で得られるよりは物理的に大き なフローティングディフュージョンが生じることが分か 40 る。更に、図2及び図3から、隣接ピクセル境界内での 光検出器の配置は同じでないことは明らかである。

【0006】高い充填比を有する別のピクセルアーキテ クチャと、Guidash により提案された共有増幅器ピクセ ルの能力のように、CDSを実行できる能力と、更に各 ピクセル内の光検出器の同じ配置で、より線形である電 荷- 電圧変換を有するセンサが望まれている。

# [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上述の点に鑑

S)を実行する能力のある高い充填比のアクティブピク セルアーキテクチャを提供することを目的とする。

# [0008]

【課題を解決するための手段】上記の目的は、行と列に 形成された複数のピクセルを有する半導体基板からなる 一連の行及び列に配された複数のピクセルを有する画像 センサにより達成される。少なくとも2つのピクセルの 夫々は、互いに空間的に分離され、単一のリセットトラ ンジスターのソースに電気的に接続された電圧- 電荷変 換領域を有する。更に、リセットトランジスターを共有 するピクセルは、増幅器と選択電気的機能を共有する。 好ましい実施態様では隣接ピクセルを考慮するが、ただ し、すぐ隣のピクセルである必要はない。4つのトラン ジスターピクセルの機能性は維持され、単一のフローテ イングディフュージョン領域の必要性と、付随する電荷 -電圧変換の非線形性とピクセルアレイ内の隣接光検出 器配置の非対称性とを排除しながら、共有増幅器ピクセ ルアーキテクチャの高い充填比は維持される。

#### [0009]

【発明の実施の形態】図4及び図5には、本発明により 考えられたアクティブピクセルセンサ (APS) の共有 増幅器トランジスターピクセルのアーキテクチャの平面 図を示す。図4及び図5に示す実施態様は、発明者が知 るかぎりでのベストモードを示す。他の物理的実施態様 は実現可能であり、後述の説明から図4及び図5に示す 実施態様のさまざまな変形態様である。図4に示すピク セル10は、数多の行及び列を有するピクセルのアレイ 内での単一のピクセルである。2つの隣接ピクセルを図 4に示し、各ピクセルで物理的に分離したフローティン グディフュージョンを相互に、またソースフォロワ入力 トランジスターとどのように相結合しているかを示す。 図4に示す実施態様は2つの行の隣接ピクセル間に共有 された増幅器のあるフォトダイオードピクセルを示す。 なお、この新規なアーキテクチャはフォトゲートピクセ ルにも利用可能であることを指摘しておく。

【0010】図4から分かるように、ピクセル10は、 フォトダイオード光検出器12と、トランスファーゲー ト23と、フローティングディフュージョン25と、リ セットゲート15のあるリセットトランジスター14と ソースフォロワ入力信号トランジスター21 (SIG) と、リセットトランジスター14とソースフォロワ入力 トランジスター21の電圧供給18(VDD)と、行選 択ゲート(RSG)31のある行選択トランジスター3 0とからなる。図4に示すアーキテクチャは、フローテ イングディフュージョンが2つの行隣接ピクセルにより 電気的に共有される2つの物理的及び空間的に分離され た分離フローティングディフュージョン領域からなる以 外は、図2に示す先行技術での共有増幅器ピクセルのそ れと同じである。図4では、フローティングディフュー みてなされたものであり、相関二重サンプリング(CD 50 ジョン25は相互に物理的及び空間的に分離され、導電

性インターコネクト層45により相互に及びソースフォ ロワ入力トランジスター21に電気的に接続している。 図4に示すように、フローティングディフュージョン2 5、FDbはリセットトランジスター14のソース16 により通常占有される面積を占有するように統合され る。フローティングディフュージョン25、FDbと同 じ電気的ノードにありながら、フローティングディフュ ージョン25、FDaはフローティングディフュージョ ン25、FDbから空間的に分離している。したがっ じ電気的ノードにありながら、フローティングディフュ ージョン25、FDaはリセットトランジスター14の ソース16として働かず、一方、フローティングディフ ュージョン25、FDbはリセットトランジスター14 のソース16として働く。これは図2に示すピクセルと は対照的であり、図2では2つのフォトダイオードとト ランスファーゲートは単一のフローティングディフュー ジョン領域と結合している。相接続した2つの物理的に 分離したフローティングディフュージョンを有すること により、トランスファーゲートは光電荷を同じ物理的フ ローティングディフュージョン領域へ移動させる必要は ないので、ピクセル境界内でのフォトダイオードとトラ ンスファーゲートの配置に制限を与えることはない。こ のことはピクセル境界内でのフォトダイオードの同じ配 置を一層容易に可能とし、よって図2に示すような同じ でない配置を有することによる生じる起こり得る別のア ーティファクトを軽減する。フローティングディフュー ジョンは相互に配線され、単一の電荷- 電圧変換ノード を形成するので、フローティングディフュージョン25 は電気的に共有される。フローティングディフュージョ ンは導電性層36により相互に接続されているので、フ ローティングディフュージョン25 FDbがリセット

【0011】図5に示す実施態様は、4つの行と列の隣 接ピクセル40が共通の構成部品を共有している場合を 示す。図5から分かるように、4つのピクセル40はフ オトダイオード光検出器42(PD1a、PD2a、P D1b、PD2b) と、トランスファーゲート43 (T Gla、TG2a、TG1b、TG2b) と、フローテ イングディフュージョン45 (FDa、FDb)と、リ セットゲート15(RG)のあるリセットトランジスタ -14と、ソースフォロワ入力信号トランジスター21 (SIG) と、リセットトランジスター14とソースフ オロワ入力トランジスター21の電圧供給18 (VD D)と、行選択ゲート(RSG)31のある行選択トラ ンジスター30とからなる。更に、図5に示すアーキテ クチャは、フローティングディフュージョン45が電気 的に接続し、4つの行及び列の隣接ピクセル40により 共有される空間的に分離した分離フローティングディフ 50

されると、フローティングディフュージョン25 FD·

a もリセットされて同じ電圧にある。

6

ュージョン領域からなる以外は、図3に示す先行技術で の共有増幅器ピクセルのそれと同じである。図5では、 フローティングディフュージョン45 (FDa、FD b) は相互に接続し、導電性インターコネクト層55に よりソースフォロワ入力トランジスター21と接続した 物理的に分離したアクティブエリア領域である。フロー ティングディフュージョン45(FDa、FDb)のい ずれもリセットトランジスター14のソース16として 統合していない。代わりに、分離活アクティブエリア領 て、フローティングディフュージョン25、FDbと同 10 域がリセットトランジスター14のソース16として利 用され、更に、この領域は導電性層55によりフローテ イングディフュージョン45 (FDa、FDb) 及びS IG21へ接続される。

> 【0012】図5のアーキテクチャとレイアウトと図3 (4つのフォトダイオードとトランスファーゲートが単 一のフローティングディフュージョン領域に結合してい る)のそれとを比較すると、フローティングディフュー ジョン領域の面積は図5よりは小さい。結果として、図 5での電荷-電圧変換ノードの全静電容量はインターコ ネクトの静電容量のような電圧に無関係な静電容量から なる。結果として、電荷-電圧変換は入力信号範囲であ まり変動しなくなる。更に、図4と同様に、電気的に相 接続した物理的に分離したフローティングディフュージ ョン領域45を有することにより、トランスファーゲー ト43は光電荷を単一のフローティングディフュージョ ン領域へ移動させる必要がないので、ピクセル境界内で のフォトダイオード42とトランスファーゲート43の 配置に制限が加わらなくなる。図5から分かるように、 このことによりピクセル境界内でのフォトダイオード4 2は同じ配置になり、図3に示す同じでない配置を有す ることにより起こり得る別のアーティファクトが軽減さ れる。フローティングディフュージョンは互いに配線さ れ、単一の電荷-電圧変換ノードを形成するので、フロ ーティングディフュージョン45はいまだに電気的に共 有されている。リセットトランジスター14のソース1 6がリセットされると、フローティングディフュージョ ンは導電性層55により相互に接続されているので、双 方のフローティングディフュージョン45 (FDa、F Db) はリセットされて同じ電位になる。リセットゲー ト15のスイッチが切れると、リセットトランジスター 14のソース16及びフローティングディフュージョン 45 (FDa、FDb) は一定でない (浮動してい る)。電荷がフォトダイオード42の1から移動する と、フローティングノードの電圧は相接続した領域の全 静電容量に応じて変化する。

【0013】この新規な相接続したフローティングディ フュージョン領域のコンセプトで、4つのピクセル以上 の作動構成部品を共有することが可能である。このこと を図6に示す。この場合、行選択トランジスター30、 リセットトランジスター14、及びソースフォロワ入力

トランジスター21 (SIG) は8つのピクセル50間 で共有される。4つの空間的に分離されたフローティン グディフュージョン46(FDa、FDb、FDcとF Dd) は相互に配線され、リセットトランジスター14 のソース16とソースフォロワ入力トランジスター21 のゲート22に電気的に接続される。更に、フローティ ングディフュージョン領域46は最小化され、各ピクセ ル50内のフォトダイオード52の同じ配置が達成され る。より小さいピクセル面積が光検出器以外の構成部品 により占有されるので、すこぶる高い充填比は効率のよ 10 い増幅器の共有で得られる。単一の行選択トランジスタ 一、リセットトランジスター及びソースフォロワ入力ト ランジスターを共有するピクセルの数は行の数に任意に 拡大する。行ごとに追加のトランスファーゲートバスを 有することにより、列の数を含むように拡大することも 可能である。単一の組の作動構成部品を共有するピクセ ルの数が増えるにつれて、相互に接続したフローティン グディフュージョン領域の数とインターコネクトの静電 容量により、フローティングディフュージョンの静電容 量は増加する。結果として、最大の許容変換静電容量、 又は最小の許容変換ゲインにより増幅器セットを共有す るピクセルの数に実用的に制限がある。

【0014】前述の説明は発明者による最善の実施態様 を詳細に示している。上記実施態様の変形態様は当業者 には容易に明らかであろう。したがって、本発明の範囲 は添付した特許請求の範囲により確定されるべきであ る。

#### [0015]

【発明の効果】上述の如く、本発明によれば、本当の相 関二重サンプリング (CDS) のあるアクティブピクセ 30 ルセンサを提供する。得られた効果は高い充填比、つま り小さなピクセル、電荷-電圧変換の線形性及び各ピク セル内での同じ光検出器配置である。不利益な点は予測 できない。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】4つのトランジスターのフォトダイオードアク ティブピクセルセンサのピクセルでの先行技術のアーキ テクチャの略平面図である。

【図2】アクティブピクセルセンサの先行技術での共有 増幅器のフォトダイオードピクセルアーキテクチャの二 つの隣接ピクセルの平面図である。

【図3】アクティブピクセルセンサの先行技術での共有 増幅器のフォトダイオードピクセルアーキテクチャの4 つの隣接ピクセルの平面図である。

【図4】アクティブピクセルセンサの新規な共有増幅器 のフォトダイオードピクセルアーキテクチャの4つの隣 接ピクセルの平面図である。

【図5】アクティブピクセルセンサの新規な共有増幅器 のフォトダイオードピクセルアーキテクチャの異なる実 施態様の4つの隣接ピクセルの平面図である。

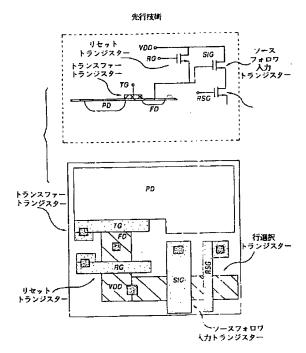
【図6】アクティブピクセルセンサの新規な共有増幅器 のフォトダイオードピクセルアーキテクチャの異なる実 施態様の8つの隣接ピクセルの平面図である。

#### 【符号の説明】

8		VDD
	_	

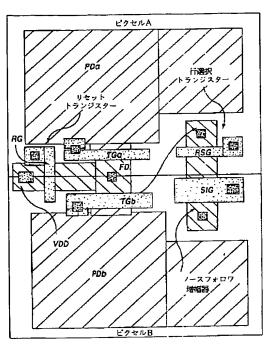
- 10 ピクセル
- 1 2 フォロダイオード
- 1 4 リセットトランジスター
- 1 5
- リセットトランジスターゲート 1 6 **リセットトランジスターソース**
- 2 1 ソースフォロワトランジスター
- 2 2 ソースフォロワトランジスターのゲート
- 23 トランスファーゲート
- 2 5 フローティングディフュージョン
- 3 0 行選択トランジスター
- 3 1 行選択ゲート
- 4 0 ピクセル
- 4 2 フォトダイオード
- 4 3 トランスファーゲート
- 4 5 フローティングディフュージョン
- 46 フローティングディフュージョン
- 50 ピクセル
- 53 トランスファーゲート
- 5 5 インターコネクト層
- 6 5 インターコネクト層

【図1】



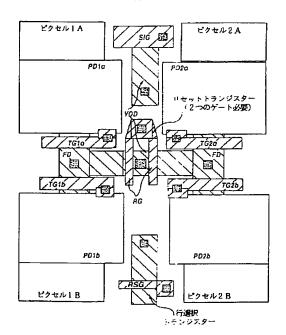
【図2】





【図3】

先行技術



【図4】

